

论文

DCTT统计最优化模型及其性质

郝跃

西安电子科技大学微电子所 西安 710071

收稿日期 1991-9-2 修回日期 1992-8-10 网络版发布日期 2009-8-24 接受日期

摘要

本文提出了集成电路最优化中综合考虑成品率极大、最佳容差设计、调整设计和生产效益极大化设计的统计最优化模型(Design Centering, Tolerance and Tuning, 简称DCTT模型)。讨论了该模型与广义统计最优化模型的等价性以及其他主要性质。在确定性最优化框架下, 该模型为统计最优化和集成电路可制造性设计的进一步发展开辟了新途径。

关键词 [集成电路](#) [统计最优化](#) [不可微规划](#)

分类号

DCTT STATISTICAL OPTIMIZATION METHOD AND ITS FEATURES

Hao Yue

Xidian University Xi'an 710071

Abstract

A statistical optimization method of integrated circuit design is proposed. This model summerizes optimal centering design of yield maximization, optimal tolerance, tuning design and maximum production profit design. The equivalence between this method and the general statistical optimization method is discussed, and the main features of the model are given. Based on the frame of deterministic optimization method, the general statistical optimization method can be improved further by the model proposed in this paper.

Key words [Integrated Circuits](#) [Statistical optimization](#) [Nondifferentiable programming](#)

DOI :

通讯作者

作者个人主页 [郝跃](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1041KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“集成电路”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [郝跃](#)